

SERVICE DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

Fiche de demande

Responsable technique : V. COLLIERE
tél. : 05- 61-17-58-50 mél. : colliere@lcc-toulouse.fr

Nom : tél :
Equipe :
Date :

Type de caractérisation :

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> TEM JEM 1011 | <input type="checkbox"/> TEM JEM 2010 | <input type="checkbox"/> TEM-FEG JEM 2100F |
| <input type="checkbox"/> MEB-FEG JEM 6700F | <input type="checkbox"/> Analyse X | <input type="checkbox"/> Analyse X |
| <input type="checkbox"/> Analyse X | | <input type="checkbox"/> |

Référence(s) échantillon(s) :
.....

Composition(s) échantillon(s) :
.....

Nature échantillon(s) (poudre, grille, support silicium...) :

Remarques (toxique, magnétique, sensibilité à l'air, oxydé...) :
.....

Observation sur l'échantillon (forme, taille, organisation...) :
.....

Echantillon(s) tiré(s) sous vide secondaire (12 heures) : OUI NON

Paramètre de travail en MEB-FEG (si déjà utilisé) :
Préparation de l'échantillon (laque d'argent, scotch carbone...) :
Tension :
Hauteur de l'échantillon (WD mm) :